

ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
ПОВЕРХНОСТНЫХ ЯВЛЕНИЙ

УДК 539.23

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА АТОМНО-СЛОЕВОГО ОСАЖДЕНИЯ
ОКСИДА МОЛИБДЕНА И ТИТАН-МОЛИБДЕНОВЫХ ОКСИДНЫХ
ПЛЕНОК МЕТОДОМ КВАРЦЕВОГО ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
МИКРОВЗВЕШИВАНИЯ

© 2022 г. А. М. Максумова^а, И. М. Абдулагатов^{а,*}, Д. К. Палчаев^а,
М. Х. Рабаданов^а, А. И. Абдулагатов^а

^а Дагестанский государственный университет, 367000, Махачкала, Россия

*e-mail: ilmutdina@gmail.com

Поступила в редакцию 19.01.2022 г.

После доработки 19.04.2022 г.

Принята к публикации 20.04.2022 г.

Проведено исследование процесса термического атомно-слоевого осаждения (АСО) пленок оксида молибдена (MoO_x) с использованием MoOCl_4 и H_2O , а также титан-молибденовых оксидных ($\text{Ti}_x\text{Mo}_y\text{O}_z$) тонких пленок с использованием TiCl_4 , MoOCl_4 и H_2O . Процесс роста пленки исследовали *in situ* методом кварцевого пьезоэлектрического микровзвешивания (КПМ) в диапазоне температур от 115 до 180°C. Рассмотрены процессы АСО пленок $\text{Ti}_x\text{Mo}_y\text{O}_z$ с различным соотношением субциклов $\text{TiCl}_4\text{--H}_2\text{O}$ и $\text{MoOCl}_4\text{--H}_2\text{O}$ в суперцикле. Во всех случаях установлен линейный рост пленки с количеством АСО циклов. Показано, что поверхностные реакции галогенидов и H_2O носили самоограничивающийся характер. Согласно данным КПМ, сделан вывод о возможности использования рассмотренной химии поверхности для осаждения тонких пленок MoO_x и $\text{Ti}_x\text{Mo}_y\text{O}_z$. Установлены потенциальные области применения данных тонких пленок: катализ, электрохромные устройства, литий-ионные аккумуляторы, антибактериальные покрытия и т.д.

Ключевые слова: атомно-слоевое осаждение, MoO_3 , MoOCl_4 , легирование TiO_2 , $\text{Ti}_x\text{Mo}_y\text{O}_z$

DOI: 10.31857/S0044453722100181

Известно, что диоксид титана (TiO_2) широко распространен в природе, не токсичен и обладает фотокаталитическими свойствами. Значение ширины запрещенной зоны TiO_2 в зависимости от кристаллической структуры находится в пределах от 3.0 до 3.4 эВ. Это ограничивает его область активации ультрафиолетовой областью, которая составляет лишь $\approx 3\%$ солнечного спектра [1]. Поэтому разработка активного в видимой области света диоксида титана — одна из ключевых задач в области фотокатализа полупроводников [2]. Одним из подходов к модификации оптических свойств TiO_2 служит легирование ионами переходных металлов [3]. Легированные покрытия можно получить различными газофазными методами, такими как химическое осаждение из газовой фазы (ХОГФ) [4], магнетронное распыление [5], испарение лазерным лучом [6] и т.д. Метод атомно-слоевого осаждения (АСО) под названием «молекулярное наслаивание» был впервые разработан в 60-е годы прошлого столетия советскими учеными В.Б. Алесковским и С.И. Кольцовым [7]. Данная технология позволяет на ато-

марном уровне контролировать толщину и состав получаемых пленок [8, 9]. Поэтому АСО нашло широкое применение для получения и в том числе легированных тонких пленок. В прошлом для легирования АСО TiO_2 были успешно использованы ванадий [10], углерод [11], азот [12–14], ниобий [15], сера [16], цинк [17], фтор [18], тантал [19] и т.д. В данной работе впервые исследовали процесс термического АСО оксида титана, легированного молибденом, с использованием тетрахлорида титана, окситетрахлорида молибдена и воды. Возможность использования оксидных сплавов титана и молибдена в фотокатализе ранее была продемонстрирована в работах [20, 21]. Кроме этого, пленки $\text{Ti}_x\text{Mo}_y\text{O}_z$ могут найти применение в литий-ионных аккумуляторах [22], газовых сенсорах [23] и т.д.

Процесс АСО $\text{Ti}_x\text{Mo}_y\text{O}_z$, рассмотренный в данной работе, является комбинацией двух процессов: АСО TiO_2 и MoO_3 . В настоящее время АСО TiO_2 продемонстрировано с использованием множества различных типов прекурсоров.

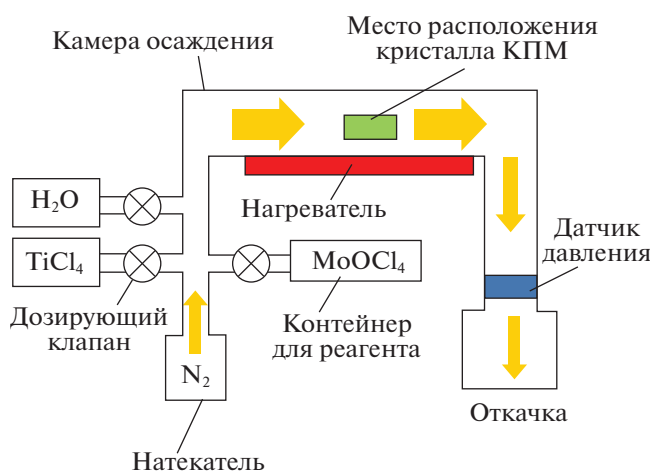


Рис. 1. Схема установки для АСО тонких пленок.

Ниже приведены только некоторые из них: тетрагидрохлорид титана ($TiCl_4$) [24]; изопропоксид титана ($Ti(OiPr)_4$) [25]; тетрааксиддиметиламинотитан ($Ti(NMe_2)_4$) [26]; бис-(изопропоксид)-бис-(2,2,6,6-тетраметилгептан-3,5-дионат) титана ($Ti(OiPr)_2(thd)_2$) [27] и др. в комбинации с такими окислителями как H_2O , O_3 , H_2O_2 и т.д. [28]. В качестве прекурсоров для получения пленок MoO_x ранее были использованы гексакарбонил молибдена ($Mo(CO)_6$) [29]; бис-этилбензол молибдена ($MoC_{16}H_{20}$) [30]; диоксо-бис-(N,N' -диизопропил-ацетоамидинат) молибдена (VI) ($MoO_2(iPr_2amd)_2$) [31]; бис-(*mpem*-бутилимидо)-бис-(диметиламино)молибден (VI) ($Mo(NtBu)_2(NMe_2)_2$) [32]; окситетрахлорид молибдена (VI) ($MoOCl_4$) [33]; диоксо-бис-(2,2,6,6-тетраметилгептан-3,5-дионат)молибден (VI) ($MoO_2(thd)_2$) [34]; диоксо-бис-(N,N' -*mpem*-бутилацетоамидинато)молибден (VI) ($MoO_2(tBuamd)_2$) [35]; $Mo(CpSiMe_3)(CO)_2(2$ -метилаллил) [36], в комбинации с H_2O , O_3 и $H_2O + O_3$. Тонкие пленки MoO_x находят применение в катализе [37, 38], электрохромных устройствах [39], литий-ионных батареях [40], газовых сенсорах [41], в качестве антибактериальных покрытий [42].

В сравнении с часто используемыми в АСО TiO_2 и MoO_x органометаллическими прекурсорами, их галогениды обладают достаточным давлением паров при комнатной температуре или могут быть относительно легко переведены в газовую фазу нагревом. В связи с этим в данной работе АСО $Ti_xMo_yO_z$ проводили с использованием $TiCl_4$, $MoOCl_4$ и H_2O . В качестве альтернативного прекурсора молибдена (VI) может быть использован более термически стабильный диоксиддихлорид молибдена MoO_2Cl_2 [43, 44], однако он обладает более высокой температурой плавления ($175^\circ C$) [45].

Цель данной работы – исследование поверхностных процессов, происходящих при АСО оксида молибдена и титан-молибденовых оксидных тонких пленок при помощи КПМ в диапазоне температур 115 – $180^\circ C$.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

АСО оксида молибдена и титан-молибденовых оксидных пленок проводили на оборудовании компании ООО “АСО НаноТех”. Упрощенная схема экспериментальной установки приведена на рис. 1.

Для АСО использовали вакуумную камеру с горячими стенками, выполненную из стали марки AISI 304L, которую продували потоком газоносителя. В качестве газоносителя использовали азот особой степени чистоты от ООО “Гермесгаз” (N_2 , 99.999%). Напуск паров прекурсоров осуществляли посредством открытия пневматических дозирующих клапанов, которые установлены между контейнером с прекурсором и реактором. Последовательность и продолжительность напуска прекурсоров задавали программой. Парциальные давления прекурсоров регистрировали встроенным на выходе из реактора датчиком давления как показано на схеме. С помощью регулятора расхода газа (РРГ) давление в реакторе поддерживали азотом на уровне ~ 1.0 Торр. При этом РРГ устанавливали на расход в 100 cm^3/min . $TiCl_4$ и $MoOCl_4$ перед экспериментом загружали в контейнеры для дозирования в атмосфере аргона. Чистота $TiCl_4$ (Sigma-Aldrich, кат. номер 7550450) и $MoOCl_4$ (Sigma-Aldrich, кат. номер 13814750) составляла ≥ 99.0 и 97.0% , соответственно. Воду использовали хроматографического класса чистоты (Fisher Chemical, кат. номер W5-1). АСО проводили при температурах 115 , 150 и $180^\circ C$. Во время АСО $MoOCl_4$ грели до $60^\circ C$ для сублимации и достижения достаточного давления паров. Температура плавления $MoOCl_4$ составляет $105^\circ C$ [45]. Известно, что $MoOCl_4$ термически нестабилен и очень медленно [43] подвергается разложению при $25^\circ C$. Визуально изменение цвета прекурсора после нагревания в контейнере до $60^\circ C$ не наблюдалось.

Изучение и оптимизацию процесса роста пленок проводили в АСО-установке, снабженной кварцевыми микровесами, позволяющими проводить исследование роста пленки в режиме реального времени (*in situ*). КПМ-оборудование, использованное в данной работе, схоже с описанным в работе [46]. КПМ-измерения выполняли с использованием электронного модуля STM-2 (Inficon). Корпус КПМ выполнен компанией Inficon. Разрешение кварцевых микровесов по массе составляет ~ 0.3 ng/cm^2 . До начала осаждения пленок MoO_x или $Ti_xMo_yO_z$ кристалл КПМ по-

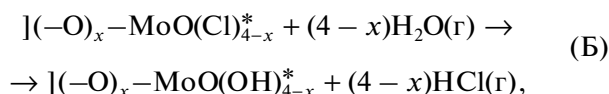
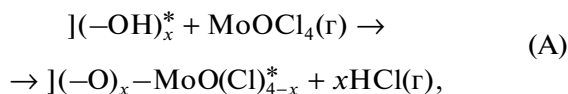
крывали пленкой АСО Al_2O_3 , для этого использовали триметилалюминий (ТМА, $\text{Al}(\text{CH}_3)_3$) и воду. ТМА с чистотой 97% (Sigma-Aldrich, кат. номер 257222) использовали при комнатной температуре без нагрева. В процессе роста Al_2O_3 наблюдали линейный прирост массы с количеством циклов со средним приростом массы за цикл ~ 33.0 нг/см², что хорошо согласуется с ранее опубликованными данными [47]. Значения погрешностей, полученные для каждой точки на кривых насыщения, представляют разброс данных по 10 точкам для разных экспериментов. Относительная погрешность для данных измерений составляет 1.07%. Активная площадь кварцевого кристалла, на которой происходило осаждение, составляла 0.65 см² и по прилагаемой программе пересчитывалась на площадь 1 см².

Время напуска и продувки прекурсоров во время одного АСО цикла MoO_x обозначали как $t_1/t_2/t_3/t_4$, где t_1 – время напуска паров MoOCl_4 ; t_2 и t_4 – время продувки; t_3 – время напуска паров H_2O . Один АСО суперцикл осаждения $\text{Ti}_x\text{Mo}_y\text{O}_z$ обозначали как $t_1/t_2/t_3/t_4/t_5/t_6/t_7/t_8$, где t_1 – время напуска паров TiCl_4 ; t_2, t_4, t_6, t_8 – время продувки; t_3, t_7 – время напуска паров H_2O ; t_5 – время напуска паров MoOCl_4 . Соотношение субциклов TiCl_4 – H_2O и MoOCl_4 – H_2O в процессе АСО $\text{Ti}_x\text{Mo}_y\text{O}_z$ варьировали, меняя количество $t_5/t_6/t_7/t_8$ субциклов в суперцикле. Парциальные давления MoOCl_4 , TiCl_4 и H_2O при времени напуска в течение 1 с составляли ~ 5 , ~ 15 и ~ 50 мТорр, соответственно. Термодинамические расчеты проводили с использованием программы HSC Chemistry.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Атомно-слоевое осаждение MoO_x

Рост пленки MoO_x осуществлялся за счет поверхностных реакций паров MoOCl_4 и H_2O . Термодинамические расчеты для газофазной реакции $\text{MoOCl}_4(\text{r}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{r}) \rightarrow \text{MoO}_3 + 4\text{HCl}(\text{r})$ при 150°C ($\Delta G = -17.23$ ккал/моль) показывают, что данная реакция может протекать самопроизвольно. Процесс АСО MoO_x схематично можно представить в виде циклически повторяющихся поверхностных полуреакций:



где * – поверхностные реакционные группы,] – поверхность, x – количество прореагировавших гидроксильных групп ($-\text{OH}$), HCl – газообраз-

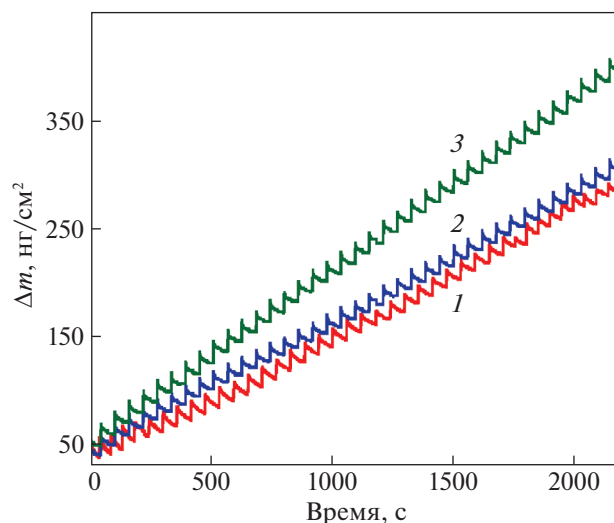


Рис. 2. Прирост массы (Δm), наблюдаемый в процессе АСО MoO_x при 115 (1), 150 (2) и 180°C (3).

ный продукт поверхностных реакций. По представленной выше схеме после напуска MoOCl_4 на поверхности образуется монослой молибденосохлоридных групп, а напуск паров H_2O приводит к замещению хлор-ионов на гидроксильные группы, что приводит к регенерации поверхностных функциональных групп, благодаря которым, происходит дальнейший рост пленки.

На рис. 2 представлены КПМ-данные о зависимости прироста массы от времени осаждения в процессе АСО MoO_x при 115, 150 и 180°C.

Процесс проводили с временными параметрами напуска и продувки 1/30/1/30. При температуре АСО 115°C прирост массы был наименьшим, максимальный прирост массы наблюдался при 180°C. Скорость прироста массы при 150 и 115°C была примерно одинаковой. При 150 и 180°C наблюдали линейный рост пленки с количеством АСО-циклов и высокую повторяемость поверхностных процессов от цикла к циклу. Повторяемость процесса и линейность роста пленки была хуже при 115°C.

Зависимость прироста массы, приходящегося на один цикл АСО MoO_x , от продолжительности напуска MoOCl_4 и H_2O при температуре АСО 150°C приведена на рис. 3. Данные эксперименты были проведены для определения самонасыщаемости поверхностных полуреакций (А) и (Б). Результаты для MoOCl_4 были получены с использованием временных параметров одного цикла $\alpha/30/1/30$, где α – варьируемое время напуска паров MoOCl_4 , 1 с – фиксированное время напуска паров H_2O и 30 с – время продувки прекурсоров. Результаты для H_2O были получены с использованием временных параметров одного цикла $1/30/\alpha/30$, где α – варьируемое время напуска па-

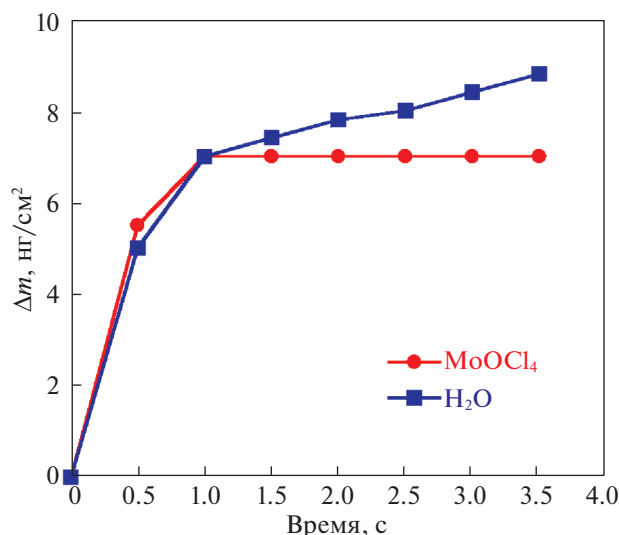


Рис. 3. Зависимости прироста массы от длительности напуска паров MoOCl_4 и H_2O в процессе АСО MoO_x при 150°C .

ров H_2O , 1 с – фиксированное время напуска паров MoOCl_4 .

Из рис. 3 следует, что прирост массы за цикл достигает насыщения уже при времени напуска паров $\text{MoOCl}_4 \sim 1.0$ с. Кривая насыщения для H_2O имеет более плавный характер, возможно, связанный с задержкой воды в реакторе и необходимостью более длительной продувки после напуска воды.

На рис. 4 представлен наблюдаемый при 150°C приближенный вид сигнала КПМ в ходе АСО MoO_x с параметрами цикла 1/30/1/30. При напуске MoOCl_4 результирующий прирост массы после напуска MoOCl_4 и шага продувки составил ~ 10 нг/см². На стадии продувки происходит некоторое снижение массы, что свидетельствует о нестабильности поверхностных комплексов и/или о медленной десорбции продуктов реакции. Напуск H_2O приводит к резкому снижению массы на 3.0 нг/см², при этом результирующий прирост массы составляет 7.0 нг/см² за цикл. Постоянную роста (δ , Å/цикл) можно получить из уравнения $\delta = \Delta m_A \rho^{-1}$, где Δm_A – прирост массы за один цикл (7.0 нг/см²), ρ – плотность кристаллического MoO_3 (4.69 г/см³); постоянная роста $\delta \sim 0.15$ Å/цикл, что близко к значению 0.1 Å/цикл, полученному ранее для АСО MoO_x при 300°C с использованием тех же прекурсоров [33]. Толщину одного монослоя MoO_3 можно рассчитать из уравнения $h = (M/(N_A \rho))^{1/3}$, где M – молярная масса MoO_3 , N_A – число Авагадро, и ρ – плотность кристаллического MoO_3 . Из приведенного уравнения толщина монослоя кристаллического MoO_3 состав-

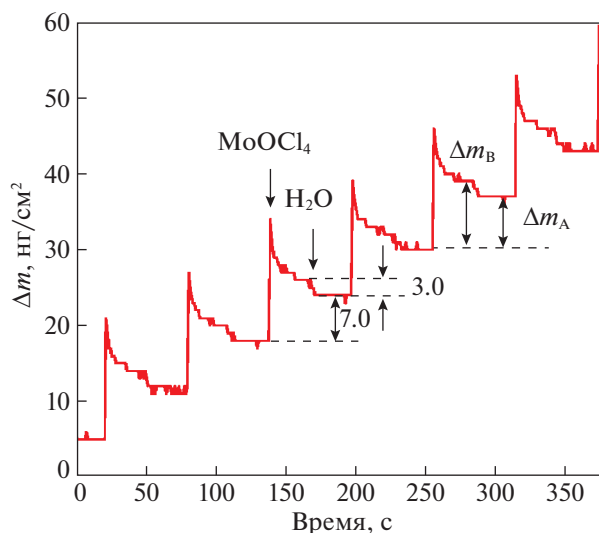


Рис. 4. Изменение прироста массы (Δm) в процессе попеременного напуска паров MoOCl_4 и H_2O при 150°C для АСО MoO_x .

ляет 3.7 Å. Расчетным путем также определили ожидаемый прирост массы на КПМ для одного монослоя MoO_3 (~ 174 нг/см²). Из этого следует, что осаждение пленки оксида молибдена в данном случае происходит в субмонослойном режиме. Прирост массы при напуске MoOCl_4 и ее снижение при дозировании H_2O соответствуют предположенной химии осаждения. Отношение общего прироста массы за один АСО цикл $\text{MoOCl}_4/\text{H}_2\text{O}$ (Δm_B) к приросту массы после напуска MoOCl_4 (Δm_A) составляет $R_{\text{MoO}_3} = 7.0/10.0 = 0.7$. Из уравнения: $R_{\text{MoO}_3} = M(\text{MoO}_3)/[M(\text{MoOCl}_4) - xM(\text{HCl})]$, где M – молярная масса, можно рассчитать долю прореагировавших –ОН-групп (x). Полученное значение $x = 1.3$ соответствует случаю, когда взаимодействие MoOCl_4 происходит в основном с одной гидроксильной группой.

В табл. 1 рассмотрены три случая, когда рост MoO_x осуществляется с участием одной, двух или трех поверхностных гидроксильных групп. При этом идеальным является случай, где $x = 2$, при котором количество регенерированных гидроксильных групп после напуска H_2O (реакция (Б)) равно количеству прореагировавших (реакция (А)). Однако экспериментально полученное значение $x = 1.3$, что указывает на высокую вероятность монодентатного присоединения MoOCl_4 ($x = 1$), в этом случае количество прореагировавших в реакции (А) гидроксильных групп становится меньше полученных в результате реакции (Б). Как было показано ранее, поверхностные реакции VOCl_3 [48] или ТМА [49] с H_2O могут быть поликонденсацией (дегидратацией) соседних металгидроксильных групп с возникновением мо-

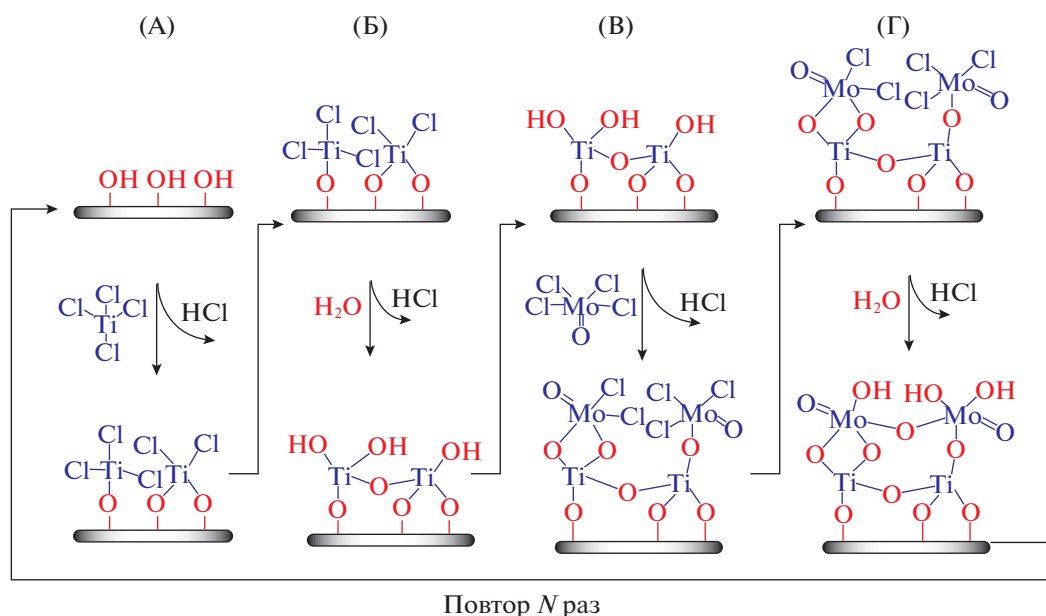


Рис. 6. Последовательность подачи реагентов в суперцикле процесса АСО $Ti_xMo_yO_z$ (1Ti1MoO).

где пары $TiCl_4$ и $MoOCl_4$ напускали в течение 1.5 с, α – варьируемое время напуска паров H_2O , 30 с – время продувки прекурсоров. Из изложенного выше следует, что поверхностные реакции галогенидов имеют самоограничивающийся характер, а кривая насыщения для H_2O имеет более плавный характер.

На рис. 8 приведены КПМ-данные по изменению массы при напуске и продувке паров реагентов в процессе роста пленки 1Ti1MoO при

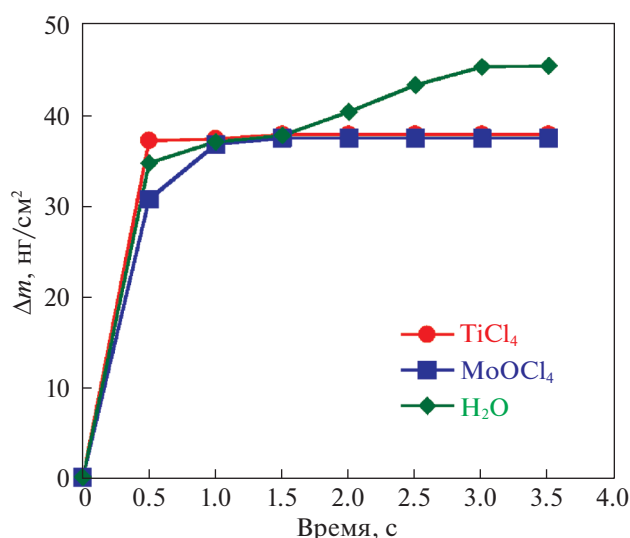


Рис. 7. Зависимость прироста массы (Δm) от длительности напуска паров $TiCl_4$, $MoOCl_4$ и H_2O в процессе осаждения АСО $Ti_xMo_yO_z$ (1Ti1MoO) при 150°C.

150°C. Рост пленки осуществлялся с использованием временных параметров одного суперцикла 1/30/1/30/1/30/1/30. Прирост массы после $TiCl_4/H_2O$ субцикла составил 17.0 нг/см², что ниже значения прироста массы в процессе АСО TiO_2 (20.2 нг/см²), полученного при схожих условиях роста. Прирост массы после $MoOCl_4/H_2O$ -субцикла составил 20.0 нг/см², что значительно выше полученного в процессе АСО MoO_x (~7.0 нг/см², рис. 3). Увеличение прироста массы за субцикл $MoOCl_4/H_2O$ свидетельствует о повышении концентрации реакционноспособных поверхностных групп после $TiCl_4/H_2O$ -субцикла.

Из отношения общего прироста массы за субцикл (20.0 нг/см²) к приросту массы при напуске $MoOCl_4$ (24.0 нг/см²) рассчитали количество гидроксильных групп (x), принявших участие в реакции поверхностного гидролиза (2.2), что указывает на бидентатное присоединение $MoOCl_4$ к поверхностным функциональным группам в процессе роста 1Ti1MoO. Изменение механизма поверхностных реакций также может быть связано с формированием поверхностных донорно-акцепторных комплексов $(-O)_xTi \leftarrow :O = MoCl_4$, вследствие образования координационной связи между неподеленной электронной парой атома кислорода в молекуле $MoOCl_4$ с вакантными d -орбиталями атомов титана [52].

Для увеличения относительного содержания молибдена в титан-молибденовой оксидной пленке АСО проводили с использованием одного субцикла $TiCl_4/H_2O$ и семи субциклов $MoOCl_4/H_2O$ в суперцикле (пленки 1Ti7MoO). На рис. 9 приве-

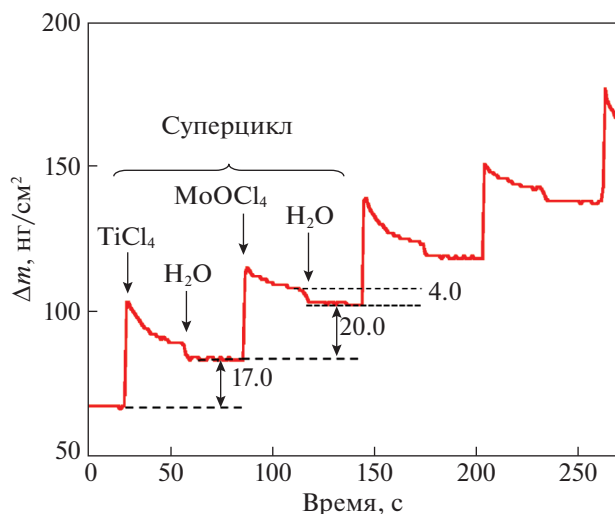


Рис. 8. Прирост массы (Δm) в процессе АСО титан-молибденовой оксидной пленки (1Ti1MoO) в зависимости от роста.

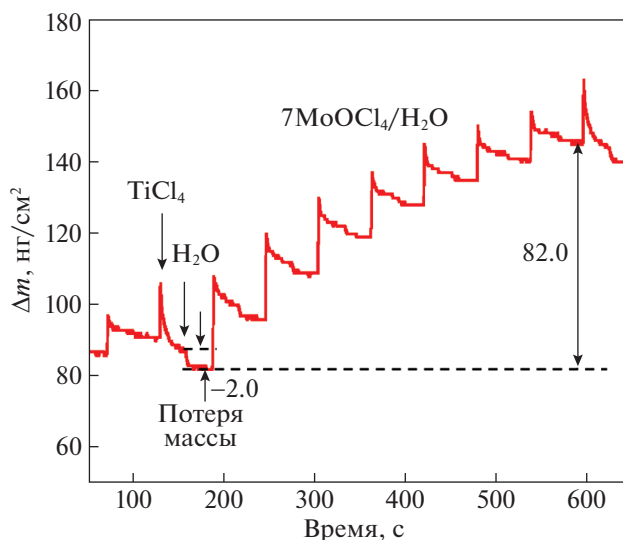


Рис. 9. Изменение массы (Δm) для одного суперцикла в процессе АСО титан-молибденовой оксидной пленки (1Ti7MoO) с семью субциклами $\text{MoOCl}_4/\text{H}_2\text{O}$.

дены данные КПМ, наблюдаемые в процессе АСО, проводимого с временными параметрами суперцикла $1/30/1/30/((1/30/1/30) \times 7)$ при 150°C .

После субцикла $\text{TiCl}_4/\text{H}_2\text{O}$ наблюдается общая потеря массы ($\sim 3.0 \text{ ng/cm}^2$). Примечательно, что потеря массы наблюдается как после напуска H_2O , так и после TiCl_4 , что свидетельствует о процессах травления пленки. Прирост массы после семи субциклов $\text{MoOCl}_4/\text{H}_2\text{O}$ составил 82.0 ng/cm^2 . Общий прирост массы за один суперцикл составил $\sim 79.0 \text{ ng/cm}^2$. С каждым последующим $\text{MoOCl}_4/\text{H}_2\text{O}$ субциклом прирост массы постепенно снижается.

Потерю массы, наблюдаемую после напуска TiCl_4 , можно объяснить его взаимодействием с поверхностным оксидом молибдена и удалением Mo в виде оксихлоридов по схеме: $\text{MoO}_3 + \text{TiCl}_4(\text{r}) \rightarrow \text{TiO}_2 + \text{MoOCl}_4(\text{r})$, $\Delta G(150^\circ\text{C}) = -5.5 \text{ ккал/моль}$ и/или $2\text{MoO}_3 + \text{TiCl}_4(\text{r}) \rightarrow \text{TiO}_2 + 2\text{MoO}_2\text{Cl}_2(\text{r})$, $\Delta G(150^\circ\text{C}) = -6.4 \text{ ккал/моль}$ (в перерасчете на один атом молибдена $\Delta G(150^\circ\text{C}) = -3.2 \text{ ккал/моль}$). Обе реакции термодинамически разрешимы при 150°C . Согласно справочным данным, температура сублимации MoO_2Cl_2 составляет 157°C [53], что близко к температуре осаждения. Сопутствующие реакции травления могут способствовать снижению содержания молибдена в осаждаемой пленке (отклонение от правила смесей), что наблюдалось ранее при осаждении других многокомпонентных АСО-пленок [10, 54]. Процессы “конвертирования” оксидов молибдена и титана могут быть схожи с процессами изоморфного замещения. Данные процессы можно объяснить [55] более низким

значением стандартной энтальпии образования TiO_2 (анатаз, $-938.7 \text{ кДж моль}^{-1}$) в сравнении с MoO_3 ($-744.6 \text{ кДж моль}^{-1}$). Потеря массы после напуска H_2O в субцикле TiO_2 объясняется реакциями замещения Cl-лигандов поверхностных оксититанхлоридных и/или оксимолибденхлоридных групп. Формирование связей Mo–Cl происходит вследствие перехода части Cl-лигандов TiCl_4 на полностью удаленные с поверхности атомы молибдена. Возможно, что схожие процессы протекают также и при осаждении пленок 1Ti1MoO, где процесс “конвертирования” после напуска TiCl_4 проявляется в меньшей степени.

На рис. 10 показан общий вид наблюдаемого при 150°C сигнала КПМ в процессе АСО $\text{Ti}_x\text{Mo}_y\text{O}_z$ с разными соотношениями субциклов. При осаждении пленок пары прекурсоров металлов и воды напускались в течение 1 с и продувались в течение 30 с.

На рис. 10 видна линейность роста пленок с количеством АСО-циклов, а также повторяемость процесса от цикла к циклу. Угол наклона линии прироста массы для 1Ti1MoO процесса выше, и, соответственно, скорость роста пленки в данном случае выше, чем для 1Ti7MoO и 2Ti7MoO. Скорость роста пленки увеличивается при увеличении количества $\text{TiCl}_4/\text{H}_2\text{O}$ -субциклов (2Ti7MoO) и убывает с увеличением количества $\text{MoOCl}_4/\text{H}_2\text{O}$ -субциклов (1Ti7MoO).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

In situ мониторинг процесса осаждения в диапазоне температур $115\text{--}180^\circ\text{C}$ позволил устано-

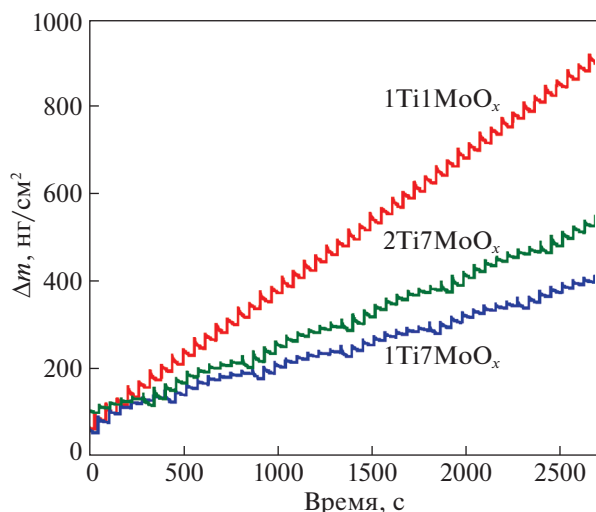


Рис. 10. Прирост массы (Δm) в процессе АСО титан-молибденовых оксидных пленок с разным соотношением субциклов при 150°C .

вить линейность роста пленок MoO_x и $\text{Ti}_x\text{Mo}_y\text{O}_z$ с количеством циклов. Для обоих типов пленок поверхностные реакции галогенидов и H_2O имели самоограничивающийся характер. Расчеты показали, что рост пленки MoO_x происходит в субмонослойном режиме. В процессе реакции MoOCl_4 с гидроксильной поверхностью в основном наблюдается монодентатное присоединение, тогда как в сплаве в процессе АСО $\text{Ti}_x\text{Mo}_y\text{O}_z$ ($1\text{Ti}7\text{MoO}$) эта реакция соответствовала бидентатному присоединению. В процессе роста пленок АСО $\text{Ti}_x\text{Mo}_y\text{O}_z$ ($1\text{Ti}7\text{MoO}$) после субцикла $\text{TiCl}_4/\text{H}_2\text{O}$ вместо ожидаемого прироста массы наблюдали ее снижение, которое объясняли “конвертированием” MoO_x и TiO_2 путем перехода хлор-лигандов TiCl_4 на поверхностные оксимольбиденовые группы и удалением Mo в газовую фазу в виде оксихлоридов. Для более детального изучения поверхностных процессов роста АСО MoO_x и $\text{Ti}_x\text{Mo}_y\text{O}_z$ запланировано проведение исследований полученных пленок с использованием инфракрасной и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Государственное задание FZNZ-2020-0002).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ren W., Ai Zh., Jia F. et al. // Appl. Catal. 2007. V. 69. № 3–4. P. 138. <https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2006.06.015>
2. Fujishima A., Zhang X.T. // C. R. Chimie. 2006. V. 9. № 5–6. P. 750. <https://doi.org/10.1016/j.crci.2005.02.055>
3. Dagherir R., Drogui P., Robert D. // Ind. Eng. Chem. Res. 2013. V. 52. № 10. P. 3581. <https://doi.org/10.1021/ie303468t>
4. Dunnill C.W., Kafizas A., Parkin I.P. // Chem. Vap. Dep. 2012. V. 18. № 4–6. P. 89. <https://doi.org/10.1002/cvde.201200048>
5. Vahl A., Veziroglu S., Henkel B. et al. // Materials. 2019. V. 12. № 17. P. 2840. <https://doi.org/10.3390/ma12172840>
6. Al Mashary F.S., Felix J.F., Ferreira S.O. et al. // MSEB. 2020. V. 259. P. 114578. <https://doi.org/10.1016/j.mseb.2020.114578>
7. Малыгин А.А. // Сборник тезисов докладов III Международного семинара “Атомно-слоевое осаждение: Россия, 2021”, 2021. С. 13.
8. George S.M. // Chem. Rev. 2010. V. 110. № 1. P. 111. <https://doi.org/10.1021/cr900056b>
9. Puurunen R.L. // J. Appl. Phys. 2005. V. 97. № 12. P. 121301. <https://doi.org/10.1063/1.1940727>
10. Абдулагатов А.И., Максумова А.М., Палчаев Д.К. и др. // Журн. прикл. химии. 2021. Т. 94. № 7. С. 835. <https://doi.org/10.1134/S1070427221070053>
11. Xie Y., Zhao X., Chen Y. et al. // J. Solid State Chem. 2007. V. 180. № 12. P. 3576. <https://doi.org/10.1016/j.jssc.2007.10.023>
12. Tian L., Soum-Glaude A., Volpi F. et al. // J. Vac. Sci. Technol. A. 2015. V. 33. № 1. P. 01A141–1. <https://doi.org/10.1116/1.4904025>
13. Lee A., Libera J.A., Waldman R.Z. et al. // Adv. Sustainable Syst. 2017. V. 1. № 1–2. P. 1600041. <https://doi.org/10.1002/adsu.201600041>
14. Pore V., Heikkilä M., Ritala M. et al. // J. Photochem. Photobiol. 2006. V. 177. № 1. P. 68. <https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2005.05.013>
15. Niemela J.P., Yamauchi H., Karppinen M. // Thin Solid Films. 2014. V. 551. P. 19. <https://doi.org/10.1016/j.tsf.2013.11.043>
16. Pore V., Ritala M., Leskelä M. et al. // J. Mater. Chem. 2007. V. 17. № 14. P. 1361. <https://doi.org/10.1039/B617307A>
17. Su C.Y., Wang L.Ch., Liu W.S. et al. // Acs Appl. Mater. Interfaces. 2018. V. 10. № 39. P. 33287. <https://doi.org/10.1021/acsami.8b12299>
18. Pore V., Kivelä T., Ritala M. et al. // Dalton Trans. 2008. V. 45. P. 6467. <https://doi.org/10.1039/B809953G>
19. Choi J.H., Kwon S.H., Jeong Y.K. et al. // J. Electrochem. Soc. 2011. V. 158. № 6. P. B749. <https://doi.org/10.1149/1.3582765>
20. Huang J.-g., Guo X.-t., Wang B. et al. // J. Spectros. 2015. V. 2015. P. 681850. <https://doi.org/10.1155/2015/681850>
21. Liu H., Lv T., Zhu Ch., Zhu Zh. // Sol. Energy Mater. Sol. Cells. 2016. V. 153. P. 1. <https://doi.org/10.1016/j.solmat.2016.04.013>

22. Zhang J., Huang T., Zhang L., Yu A. // *J. Phys. Chem. C*. 2014. V. 118. № 44. P. 25300.
<https://doi.org/10.1021/jp506401q>
23. Galatsis K., Li Y.X., Wlodarski W. et al. // *Sens. Actuators B Chem.* 2002. V. 3. № 1–3. P. 276.
24. Кольцов С.И. // *Журн. прикл. химии*. 1969. Т. 42. № 5. С. 1023.
25. Dill P., Pachel F., Miltzer C. et al. // *J. Vac. Sci. Technol. A*. 2021. V. 39. № 5. P. 052406.
<https://doi.org/10.1116/6.0001193>
26. Kavan L., Tétreault N., Moehl Th., Graetzel M. // *J. Phys. Chem. C*. 2014. V. 118. № 30. P. 16408.
<https://doi.org/10.1021/jp30790+>
27. Qi X., Jiang Yu., Detavernier C. et al. // *J. Appl. Phys.* 2007. V. 102. P. 083521.
<https://doi.org/10.1063/1.2798384>
28. Niemela J.P., Marin G., Karppinen M. // *Semicond. Sci. Technol.* 2017. V. 32. № 9. P. 093005.
<https://doi.org/10.1088/1361-6641/aa78ce>
29. Diskus M., Nilsen O., Fjellvåg H. // *J. Mater. Chem.* 2011. V. 21. P. 705.
<https://doi.org/10.1039/C0JM01099E>
30. Drake T.L., Stair P.C. // *J. Vac. Sci. Technol. A*. 2016. V. 34.
<https://doi.org/10.1116/1.4959532>
31. Jurca T., Peters A.W., Mouat A.R. et al. // *Dalton Trans.* 2017. V. 46. P. 1172.
<https://doi.org/10.1039/C6DT03952A>
32. Vos M.F.J., Bacco M., Thissen N.F.W. et al. // *J. Vac. Sci. Technol. A*. 2016. V. 34. P. 01A103.
<https://doi.org/10.1116/1.4930161>
33. Kvalvik J.N., Jon B., Hansen P.-A., Nilsen O. // *J. Vac. Sci. Technol. A*. 2020. V. 38. № 4. P. 042406.
<https://doi.org/10.1116/6.0000219>
34. Mattinen M., King P.J., Khriachtchev L. et al. // *Mater. Today Chem.* 2018. V. 9. P. 17.
<https://doi.org/10.1016/j.mtchem.2018.04.005>
35. Aidan R., Mouat A.R., Mane A.U. et al. // *Chem. Mater.* 2016. V. 28. № 6. P. 1907.
<https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.6b00248>
36. Nanayakkara C.E., Vega A., Liu G. et al. // *Chem. Mater.* 2016. V. 28. № 23. P. 8591.
<https://doi.org/10.1021/acsami.1c06204>
37. Fransén T., Meer O., Mars P. et al. // *J. Phys. Chem.* 1976. V. 80. № 19. P. 2103.
<https://doi.org/10.1021/j100560a010>
38. Lietti L., Nova I., Ramis G. et al. // *J. Catal.* 1999. V. 187. № 2. P. 419.
<https://doi.org/10.1006/jcat.1999.2603>
39. Marciel A., Graça M., Bastos A. et al. // *Mater.* 2021. V. 14. № 4. P. 821.
<https://doi.org/10.3390/ma14040821>
40. Sen U.K., Mitra S. // *RSC Adv.* 2012. V. 2. P. 11123.
<https://doi.org/10.1039/C2RA21373G>
41. Guidi V., Cardinali G., Dori L. et al. // *Sens. Actuators B Chem.* 1998. V. 49. P. 88.
[https://doi.org/10.1016/S0925-4005\(98\)00039-2](https://doi.org/10.1016/S0925-4005(98)00039-2)
42. Shahram Sh., Daniel V.O., Fey T. et al. // *Mater. Sci. Eng. C*. 2016. V. 58. P. 1064.
<https://doi.org/10.1016/j.msec.2015.09.069>
43. Pershina V., Fricke B. // *Russ. J. Phys. Chem.* 1995. V. 99. № 1. P. 144.
44. Pershina V., Fricke B. // *Ibid.* 1996. V. 100. № 21. P. 8748.
45. CRC Handbook of Chemistry and Physics. 102 ed. 2021–2022: CRC Press, Taylor & Francis Group.
46. Elam J.W., Groner M.D., George S.M. // *Rev. Sci. Instrum.* 2002. V. 73. № 8. P. 2981–2987.
<https://doi.org/10.1063/1.1490410>
47. Кутчиев А.И. Синтез и квантово-химическое исследование ванадийоксидных структур на поверхности кремнезема и их взаимодействия с парами VOCl_3 и H_2O : Дис. ... канд. хим. наук. Санкт-Петербург, 2006. 171 с.
48. Wind R.A., George S.M. // *J. Phys. Chem. A*. 2010. V. 114. № 3. P. 1281.
<https://doi.org/10.1021/jp9049268>
49. Wind R.W., Fabreguette F.H., Sechrist Z.A. et al. // *J. Appl. Phys.* 2009. V. 105. № 7. P. 074309.
<https://doi.org/10.1063/1.3103254>
50. Malygin A.A., Volkova A.N., Kol'tsov S.I., Alekskovskii V.B. // *Russ. J. Gen. Chem.* 1972. V. 42. № 11. P. 2373.
51. Malygin A.A., Volkova A.N., Kol'tsov S.I., Alekskovskii V.B. // *Ibid.* 1973. V. 43. № 7. P. 1436.
52. Malygin A.A. // *Ibid.* 2002. V. 72. № 4. P. 575.
53. Ефимов А.И., Белокурова Л.П., Василькова И.В., Чечев В.П. Свойства неорганических соединений. Справочник. Л.: Химия, 1983. С. 392.
54. Mackus A.J.M., Schneider J.R., MacIsaac C. et al. // *Chem. Mater.* 2019. V. 31. № 4. P. 1142.
<https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.8b02878>
55. George S.M. // *Acc. Chem. Res.* 2020. V. 53. № 6. P. 1151.
<https://doi.org/10.1021/cr900056b>